

Einladung zu einem Kolloquium

Vortragender:	Nils Jahn, M.Sc.
Thema:	Thermal Onboard Detection of Power Semiconductor Interconnection Faults
Inhalt:	In dieser Thesis wird ein Konzept für die Detektion von Fehlern in der Aufbau- und Verbindungstechnik von Leistungshalbleitern während des Betriebs vorgestellt. Durch eine solche Zustandsüberwachung kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit von leistungselektronischen Komponenten in autonomen und elektrischen Fahrzeugen erhöht werden. Zu diesem Ziel werden auf Basis von Messungen und Simulationen einer Testanordnung drei Auswertungsmethoden für die Fehlererkennung vorgestellt und bewertet. Diese werden darüber hinaus durch Klassifizierung mittels maschinellen Lernens ergänzt. Die vorgestellten Methoden stellen neuartige, praktikable Ansätze für die Zustandsüberwachung von Leistungshalbleitern dar, die mit geringem Rechenaufwand während des Betriebes angewendet werden können.
Termin:	28. Mai 2024 um 14:30 Uhr
Ort:	im Raum SRG – 1.004, TU Dortmund, Friedrich-Wöhler-Weg 6, 44227 Dortmund
	Online unter: https://tu-dortmund.zoom.us/j/94999678653?pwd=VzZ3VHRlVVRvY0ZlQmFDVnFSU3JKQT09
Vortragsleitung:	Prof. Dr.-Ing. Martin Pfof

bei Rückfragen wenden Sie sich an das
Dekanat für Elektrotechnik und Informationstechnik
dekanat.etit@tu-dortmund.de